

E' alle porte l'appuntamento con la manutenzione industriale *Ingegneria, Diagnostica, monitoraggio e risparmio energetico il 10 aprile a MCM Milano*

Milano, 26 marzo 2014 – Non manca molto alla nuova e attesa edizione di **MCM Milano**, mostra convegno dedicata a tutti gli operatori professionali del mondo della manutenzione industriale e asset management, che si svolgerà il prossimo 10 aprile a Milano (Centro Congressi Milanofiori).

La giornata verticale è orientata alla focalizzazione dell'impiego di nuove tecniche e strumenti che possano rendere competitive le aziende in contesti particolarmente difficili, con la manutenzione come risorsa indispensabile per l'ottimizzazione dei risultati aziendali.

La giornata verticale, modellata sulle esigenze di operatori e aziende, è organizzata da EIOm con il patrocinio di A.I.MAN. (Associazione Italiana Manutenzione) ed è un evento di primaria importanza per aggiornarsi sulle tendenze e sulle soluzioni tecnologiche più avanzate, entrare in contatto con i leader di mercato, sviluppare concrete opportunità di business.

“Ingegneria di manutenzione ed Efficienza Estesa: diagnostica e monitoraggio per affidabilità e risparmio energetico” è il tema che sarà affrontato nel denso convegno mattutino, coordinato da Francesco Cominoli (Auditech - Senior Consultant), in cui massimi esperti e importanti aziende del settore affronteranno tematiche di primaria attualità.

Molto importanti gli interventi già definiti e previsti nel corso della mattinata, come l'approfondimento sul risparmio energetico per incrementare la disponibilità impiantistica presentato dal chairman della sessione; Marco Felli (Auditech) parlerà della diagnostica e del monitoraggio per affidabilità e risparmio energetico. Il tema dell'eliminazione delle perdite su tubi in pressione sarà oggetto dell'intervento di Paola De Florentiis (Alfatec Hevo); Domenico Zanotti (Tosoni Fluidodinamica) e Dario Aiardi (System Integrator) interverranno con l'interessante case history sull'efficienza della manutenzione con idonea strumentazione e raccolta dati.

A seguire il contributo di Marco Macchi (Politecnico di Milano) con focus sulla manutenzione matura, con approfondimenti sullo stato dell'arte e sulle prospettive; in chiusura un caso applicativo di successo, la case history proposta da Sandro Turci (Infor) intitolata in cui sarà illustrato il ruolo della manutenzione secondo le linee guida della PAS 55 e della normativa ISO 55000 per una gestione degli standard di sicurezza in logica enterprise. Nel corso del convegno sarà riservato ampio spazio per il confronto e il dibattito tra i partecipanti.

La formula di MCM Milano, così come il rinomato appuntamento di Verona, oltre al convegno la giornata prevede un'area espositiva che vede la partecipazione delle più prestigiose aziende del settore, e una sessione pomeridiana con una serie di workshop tecnico-applicativi organizzati dalle stesse aziende partecipanti.

L'appuntamento meneghino, che ricordiamo si svolgerà in concomitanza con **SAVE Milano – edizione lombarda dell'evento di riferimento per automazione, strumentazione e sensoristica per l'industria di processo**, si rivolge ad un target di operatori qualificati, quali tecnici, responsabili manutenzione, asset manager, responsabili impianti e operations, ingegneri, progettisti e manutentori, strumentisti, e molti altri ancora.

Il programma è disponibile sul sito ufficiale dell'evento www.mcmonline.it/milano attraverso cui gli operatori interessati possono preregistrarsi e accedere alla manifestazione, partecipare a convegni e workshop e usufruire di tutti i servizi offerti dagli sponsor (coffee break, buffet ed eventuale documentazione, scaricabile in pdf dopo gli eventi).

MCM Milano anticipa l'evento di riferimento in Italia per gli operatori del settore: **MCM Mostra Convegno della Manutenzione Industriale**, in programma il 28 e il 29 ottobre a Veronafiere.

MCM Milano è un evento progettato da EIO Ente Italiano Organizzazione Mostre

Per info: www.mcmonline.it/milano - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it